

## Сведения о члене экспертной комиссии

1	ФИО (полностью)	Таперо Константин Иванович
2	Дата рождения (полная)	19.01.1970
3	Гражданство	Российская Федерация
4	Ученая степень (с указанием шифра специальности научных работников, по которой защищена диссертация)	Доктор технических наук (05.27.01 – «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и наноэлектроника, приборы на квантовых эффектах»)
5	Ученое звание (по кафедре, специальности)	С.н.с.
6	Место работы:	
	Почтовый индекс, адрес, web-сайт, электронный адрес организации	Московская обл., г. Лыткарино, Промзона Тураево стр. 8 <a href="http://www.niipriborov.ru/">http://www.niipriborov.ru/</a> <a href="mailto:risi@niipribor.ru">risi@niipribor.ru</a>
	Полное наименование организации в соответствии с уставом	Акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборов"
	Ведомственная принадлежность организации	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
	Тип организации	НИИ
	Наименование подразделения	Администрация
	Должность	Заместитель генерального директора по науке и инновациям
7	<p>Основные публикации в области диссертационного исследования (для членов, представляющих технические науки: не менее 7 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 2-х в Scopus/WoS; для членов, представляющих физико-математические науки: не менее 8 научных статей за последние 5 лет, из которых не менее 3-х в Scopus/WoS):</p>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petrov A.S., <b>Таперо К.И.</b>, Ulimov V.N., Chlenov A.M. Impact of elevated temperature applied during low dose rate irradiation on the degradation of BiCMOS operational amplifiers // Microelectronics Reliability. 2018, vol. 88-90, pp. 961–964.</li> <li>2. <b>Таперо К.И.</b> Low Dose Rate Effects in Silicon-Based Devices and Integrated Circuits: a Review // Russian Microelectronics, 2018, vol. 47, no. 8, pp. 539–552. DOI: 10.1134/S1063739718080127.</li> <li>3. Kir'yanov A.V., Barmenkov Y.O., Minkovich V., Das. S., Dutta D., Dhar A., Paul M.C., Didenko S.I., Legotin S.A., <b>Таперо К.И.</b> Effect of electron irradiation on the optical properties of bismuth doped hafnia-yttria-alumina-silicate fiber // Optical Materials Express, vol. 8, no. 9, Sep. 2018, pp. 2550–2558. DOI: 10.1364/OME.8.002550.</li> <li>4. Петров А.С., <b>Таперо К.И.</b>, Улимов В.Н. Исследование влияния низкоинтенсивного облучения при повышенной температуре на деградацию БИКМОП операционных усилителей // Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2018. Вып. 1. С. 31–34.</li> <li>5. <b>Konstantin Tapero</b>, "Single-Event Effects Test Methods". In book: "Radiation Effects on Integrated Circuits and Systems for Space Applications", Ed. By R. Velazco, D.</li> </ol>	



McMorrow, J. Estela. Springer Nature Switzerland AG, 2019, pp. 39–60. DOI: 10.1007/978-3-030-04660-6\_3.

6. Petrov A.S., **Tapero K.I.**, Galimov A.M., Zebrev G.I. Degradation of Bipolar Transistors at High Doses Obtained at Elevated Temperature Applied During Gamma-Irradiation // Microelectronics Reliability, vol. 100-101, September 2019, 113378. <https://doi.org/10.1016/j.microrel.2019.06.070>.
7. Kir'yanov A.V., Halder A., Sekiya E., Saito K., Barmenkov Y.O., Minkovich V.P., Didenko S.I., Legotin S.A., **Tapero K.I.** Impact of electron irradiation upon optical properties of Bismuth/Yttria codoped phosphosilicate fiber // Optics & Laser Technology, vol. 128, August 2020, 106245. <https://doi.org/10.1016/j.optlastec.2020.106245>.
8. **Tapero K.**, Orlova M., Didenko S., Yurchuk S., Sizov S. A<sup>III</sup>B<sup>V</sup> Photoelectric Converters Degradation under Ionizing Radiation // Moscow Workshop on Electronic and Networking Technologies, MWENT 2020 – Proceedings, 2020. DOI: 10.1109/MWENT47943.2020.9067376.
9. Петров А.С., **Таперо К.И.**, Труфанов С.К. Радиационно-индуцированная деградация биполярных транзисторов при высокотемпературном гамма-облучении // Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2020. Вып. 1. С. 5–8.
10. Рябцева М.В., Петров А.С., Воеводкин Г.С., **Таперо К.И.**, Вагапова Н.Т., Баньковский М.В. Исследование воздействия электронов, нейтронов и гамма-квантов на выходные характеристики трёхкаскадных фотоэлектрических преобразователей на основе A<sup>III</sup>B<sup>V</sup>/Ge // Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2021. Вып. 2. С. 16–22.
11. Воеводкин Г.С., Рябцева М.В., Бадурин И.В., Вагапова Н.Т., Логинова Е.С., **Таперо К.И.**, Петров А.С. Адаптированная методика оценки радиационной деградации фотоэлектрических преобразователей концентрированного солнечного излучения и их каскадов на базе InGaP, InGaAs и Ge // Вопросы атомной науки и техники. Сер.: Физика радиационного воздействия на радиоэлектронную аппаратуру. 2021. Вып. 3. С. 5–10.
12. Ryabtseva M.V., Petrov A.S., Voevodkin G.S., **Tapero K.I.**, Vagapova N.T., Bankovsky M.V. Degradation of A<sup>III</sup>B<sup>V</sup>/Ge Triple Junction Solar Cells Irradiated by Gamma-Rays, Electrons and Neutrons // Microelectronics Reliability, vol. 125, October 2021, 114350. <https://doi.org/10.1016/j.microrel.2021.114350>.
13. Shchemerov I.V., Legotin S.A., Lagov P.B., Pavlov Y.S., **Tapero K.I.**, Petrov A.S., Sidelev A.V., Stolbunov V.S., Kulevoy T.V., Letovaltseva M.E., Murashev V.N., Konovalov M.P., Kirilov V.N. Radiation Effect on the Polymer-Based Capacitive Relative Humidity Sensors // Nuclear Engineering and Technology, available online March 7 2022. <https://doi.org/10.1016/j.net.2022.02.027>.

8	Контактный телефон члена экспертной комиссии (желательно мобильный)
9	Адрес электронной почты